



Obsah

Vidět nerozlišitelné	PAVEL TOMÁNEK	3
Dotek atomu	ANTONÍN FEJFAR	5
O některých problémech konstrukce mikroskopů v blízkém poli	IVAN OŠŤÁDAL	11
Měření základních statistických veličin náhodné povrchové drsnosti pomocí mikroskopie atomové síly	IVAN OHLÍDAL, DANIEL FRANTA, PETR K LAPETEK	16
Rastrovací kapacitná mikroskopie — možnosti a hranice	ŠTEFAN LÁNYI	22
Optická mikroskopie v blízkém poli — alternativa, či soupeř STM a AFM?	PAVEL TOMÁNEK	28
Vývoj a aplikace zařízení pro UHV SPM	F. LOPOUR, R. KALOUSEK, D. ŠKODA, T. ŠIKOLA	33
Možnosti testování metriky přístrojů STM a AFM	FRANTIŠEK MATĚJKA, JIŘINA MATĚJKOVÁ, FILIP LOPOUR	38
Fyzikální principy a limity rozlišení bezkontaktní metody mikroskopu atomárních sil — simulace oscilací raménka	R. KALOUSEK, F. LOPOUR, P. DUB, T. ŠIKOLA	43

Vliv diskrétní Fourierovy transformace na zpracování AFM dat PETR K LAPETEK, IVAN OHLÍDAL, DANIEL FRANTA	49
Adsorpce a difuze atomů stříbra na povrchu Si(111)-(7×7) TOMÁŠ JAROLÍMEK, JOSEF MYSLIVEČEK, PAVEL SOBOTÍK, IVAN OŠŤÁDAL	52
Studium heteroepitaxního růstu tenkých vrstev pomocí STM PAVEL SOBOTÍK, IVAN OŠŤÁDAL, JOSEF MYSLIVEČEK, TOMÁŠ JAROLÍMEK, FRANTIŠEK LAVICKÝ	55
Studium povrchu plazmaticky oxidovaných tenkých vrstev hliníku pomocí AFM JAROSLAV PAVLÍK, STANISLAV NOVÁK, ZDENĚK STRÝHAL, MARTIN ŠVEC	59
Studium transportu náboje v mikrokrytalickém křemíku s vysokým prostorovým rozlišením B. REZEK, A. FEJFAR, T. MATES, J. STUHLÍK, J. KOČKA	62
AFM studium polymerů ZBYNĚK PIENKA, MIROSLAV BLEHA, FRANTIŠEK LEDNICKÝ	66
Studium lokálních charakteristik fotoproudu v blízkém poli PETR LÉTAL, LUBOMÍR GRMELA, PAVEL TOMÁNEK	69
Hodnocení buněčného poškození ve fluorescenčním inverzním mikroskopu H. KOLÁŘOVÁ, R. KUBÍNEK, K. RÉBLOVÁ, M. STRNAD	72